

PSS BAR-VI (E)

可见光 BAR 条测试机 ▶▶▶



产品简介

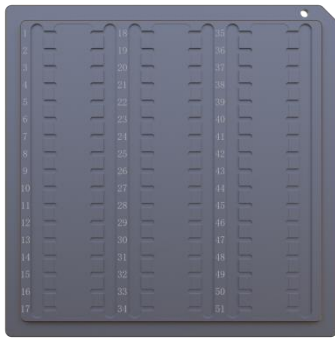
可见光 BAR 条自动测试机用于巴条 LIV 曲线，光谱，远场自动测量。全自动上下料，支持料盒上料，支持料盒或蓝膜下料。常温、高温双温测试，测试温度可由用户自定。探针加电，测试 NG chip 采取打点标记，向用户开放测量数据库，用于后续筛分工序。

产品应用

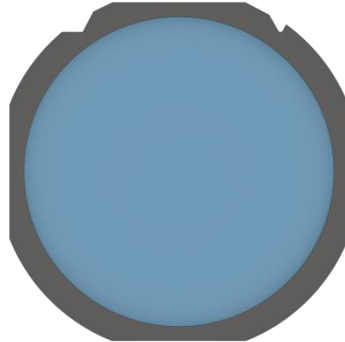
- 设备用于可见光 BAR 条自动测试，可以实现常温、高温条件下边发射芯片的光谱、LIV 参数测试

产品特点

- 支持多种主流规格料盒，全自动上下料，避免转料或人工操作对巴条 chip 造成的报废



料盒

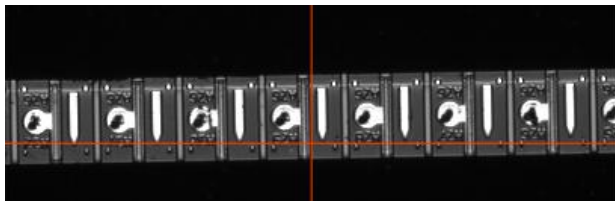


蓝膜

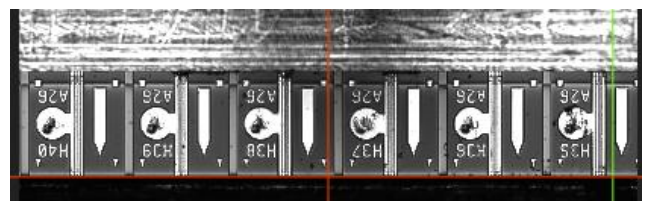


2 寸真空释放盒

- 上下料料盒配磁吸式夹具，支持快速更换不同规格料盒或蓝膜盘
- 支持 BAR 条自动上料、首颗 chip 识别定位，支持 ID 识别、自动测试、自动判断 BAR 条测试结束、自动下料

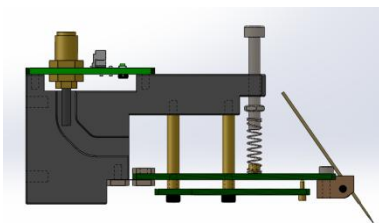


上料相机对焦（自动调整 BAR）

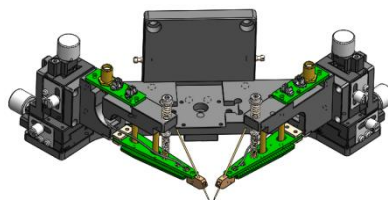


测试相机对焦

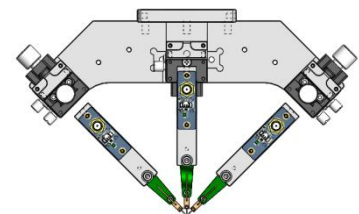
- 吸嘴、探针与 BAR 条接触压力可调
- 支持单探针、双探针、多探针加电的形态



单探针

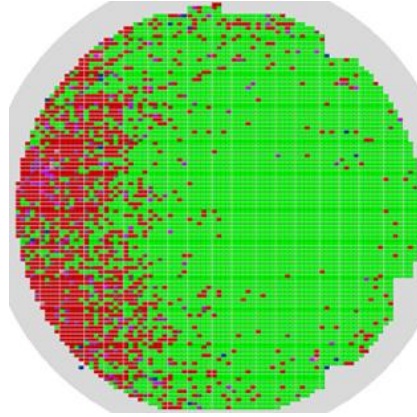


双探针



三探针、或其他探针卡的形式

- 支持前光 LIV 曲线、功率、光谱测量，背光功率测量，多参数多条件筛分，尽可能筛选出不良 chip，避免流入后道工序
- 支持 MAP 图绘制，方便用户对 wafer 的性能分布情况分析



- 支持 NG Chip 打点标记，支持简单的芯片外观检查
- 支持常温、高温测试，常温台支持温控
- 多维度可调测量结构，满足用户对不同规格巴条测量需求

■ 技术参数

参数	指标
适用巴条尺寸	长度: 15~30mm 宽度: 0.2~0.5mm, 其他 BAR 条宽度可定制测试台
仪表型号	吉时利 (Keithley) 2601B-PULSE
测量参数	LIV 曲线, Ith, Po, Vf, Im, Rs, SE, Kink 等
LD 驱动电流	小功率芯片范围 0 ~ 300mA, 精度 0.1%FS±0.5mA 大功率芯片范围 0 ~ 5A, 精度 0.1%FS±5mA
电流模式	CW/Pulse
P-I-V	Pulse 0.1ms (ON) Duty1%
正向电压测试	小功率芯片范围 0 ~ 15.0V, 精度 0.1% FS±50mV 大功率芯片范围 0 ~ 10.0V, 精度 0.1% FS±50mV
光功率测试	小功率芯片测试范围 0-300mW; 精度 0.1% FS±50uW; 波长范围 380-700nm 大功率芯片测试范围 0-10W; 精度 0.1% FS±10mW; 波长范围 380-700nm
温度控制	常温:20~85°C; 稳定性 ≤ ±0.5°C
气源要求	正压: >0.6MPa 负压: <-80KPa
电源	AC 220V/8A 50Hz